Name 氏名 (フリガナ)

〈Date 日付: month 月 day 日

Support Request Form 利用相談フォーム

Please fill in this form and send it to Nanostructural Characterization Group office as an email attachment. 依頼内容をご記入いただき、ナノ構造解析グループ事務局までメール添付にてお送りください。

Email: tem@nims.go.jp

Nanostructural Characterization Group staff takes counsel with you based on this. 以下の内容をもとに利用相談を行います。

	User 利用者	Company (Organizatio 会社(組織)名・所属				
		Job Title/Position 職	名/肩書			
		Grade For students Period of stay in NIN	1S for members o	f NIMS internship program		
		Period of stay in NIMS for visiting researchers				
		E-mail address		Pł	one Number	
	Supervisor 責任者	Name 氏名 (フリガナ)				
		Company (Organization)/Division 会社(組織)名・所属				
		Job Title/Position 職	名/肩書			
		E-mail address		Pł	one Number	
,		,		,		
		Question	naire for usage t	t ype ご利用形態につい	てご質問	
□ I would like to be able to independently operate an instrument and get data by myself. 自分で機器を操作しデータを取得したい。 *Which instrument would you like to use? (If there is a model you want to use, please write down the name) ご希望の装置を以下からお選びください。(使用したい機種がある場合は装置名をご記入ください) □ TEM : □ FIB : □ Others その他: □ Having no experience? □ Having enough practical skill 十分経験がある *If you are an experienced user, please tell us the name of instruments like JEM-2100 you are familiar with, if any. 使い慣れている装置があればメーカーや機種等を教えて下さい。(JEM-2100 等) □ I would like to request Analytical Support Service on my behalf. 分析支援サービスを技術代行で依頼したい。 □ Sample preparation and TEM observation 試料作製と TEM 観察 □ Only sample preparation 試料作製のみ □ Only TEM observation TEM 観察のみ						(ださい)

	Research Summary / Sample Information 研究概要/試料情報				
Research Summary 研究概要					
Sample Name 試料名					
Sample Type, Form, Stru	□ Bulk バルク □ Monolayer 単層膜 □ Multilayer 多層膜 □ Nano-Particles ナノ粒子 □ Others: その他:				
Electrical Characteristics	電気特性 □ Conductor 導体、□ Semi-conductor 半導体、□ Insulator 絶縁体				
Magnetic Property 磁気	□ Ferromagnetic (Fe/Co/Ni) 強磁性(鉄/コバルト/ニッケルなど) □ Ferrimagnetic (Ferrite etc.) フェリ磁性(フェライトセラミックスなど) □ Non-Magnetic 非磁性				
Elements contained in t	ne sample 含有元素				
Any other inquiries about how to use our equipment or Special Notes ご利用に関するご相談およびその他特記事項					

- ➤ The following form is for only users who want a usage type "Technical Surrogate".

 "Technical Surrogate" is a usage type that Nanostructural Characterization Group analyzes on your behalf.
 以下は技術代行をご希望の方のみご記入ください。
- > Submit this page for each sample respectively by copying the form of page 2, if there are more than one sample of different materials. 試料が異なる材料で複数ある場合は、試料ごとにご提出ください。
- If you do not have enough space, please add pages. Other attachment accepted. スペースが足りない場合は、ページを追加してください。別紙添付でも可

Information Needed for Analysis Request 分析依頼に必要な情報						
Number of Samples 試料数 ※Max 2 samples for one request. If you have additional samples, please contact us again. ※1 回の依頼につき最大 2 個です。追加試料がある場合は、再度ご相談ください。						
Please set priorities for which sample to start with if there are 2 samples. 2 個ある場合、優先順位						
Directions of sample observation 観察方向 □ Cross section 断面 □ Plan view 平面 □ Any direction 方位不問						
Precautions when handling sample 試料に関する注意事項 □ Toxic 劇物・毒物 □ Diffusible 拡散性 □ Volatile 揮発性 □ Oxidizable 酸化性 □ Heat-resistant temperature(°C) 耐熱温度 [°C] □ Intolerance for organic solvent such as ethanol or acetone 耐薬品性(アセトン・エタノール) □ Oxidizable 酸化性 □ Photoreactive 光反応性 □ Destruction Allowed 破壊可 □ Destruction not Allowed 破壊不可 □ Others to be noted その他 []						
Detailed information about your sample 詳細な試料情報 ※ You don't need this information if you request only TEM observation. TEM 観察・分析のみ依頼の場合は不要						
Initial form, size, surface roughness, crystal orientation to observe, region of interest as specifically as possible to easy understand using schematic drawings or photos. In case of Crash and Dispersion method, write the name of usable and unusable solvent. 初期形状・サイズ、表面の状態、観察したい結晶方位、特定の加工希望位置の全体写真とその部分の拡大写真、平面図、断面図などわかるように記載ください。分散法など懸濁が必要な場合は、使える溶媒と使えない溶媒を記載ください。						
Storage and disposal of samples 試料の保管と廃棄につ	Your samples we received will be disposed of 3 months after analysis is completed. お預かりした試料は、分析が完了してから 3 か月後に廃棄させて頂きます。 □ I give my consent to the above explanation 上記の説明に同意する					
いて	□ I would like to return the samples. 試料の返却を希望する					

Detailed information about analytical techniques you request 依頼したい分析手法 ※ You don't need this information if you request only sample preparation. 試料加工のみ依頼の場合は不要 HR-TEM, STEM-EDS, STEM-EELS, EDS Mapping, Line Analysis, Electron Diffraction Pattern etc. If you specify an instrument, please write its name and the reason. HR-TEM、STEM-EDS、STEM-EELS、マッピング、線分析、電子線回折図形等。機器の指定がある場合は、装置名と理由を記載ください。